

## DIN EN 61967-6



ICS 31.200

Ersatz für  
DIN EN 61967-6:2003-05  
Siehe jedoch Beginn der  
Gültigkeit

**Integrierte Schaltungen –  
Messung von elektromagnetischen Aussendungen im Frequenzbereich  
von 150 kHz bis 1 GHz –  
Teil 6: Messung der leitungsgeführten Aussendungen –  
Magnetsondenverfahren (IEC 61967-6:2002 + A1:2008);  
Deutsche Fassung EN 61967-6:2002 + A1:2008**

Integrated circuits –  
Measurement of electromagnetic emissions, 150 kHz to 1 GHz –  
Part 6: Measurement of conducted emissions – Magnetic probe method  
(IEC 61967-6:2002 + A1:2008);  
German version EN 61967-6:2002 + A1:2008

Circuits intégrés –  
Mesure des émissions électromagnétiques, 150 kHz à 1 GHz –  
Partie 6: Mesure des émissions conduites – Méthode de la sonde magnétique  
(CEI 61967-6:2002 + A1:2008);  
Version allemande EN 61967-6:2002 + A1:2008

Gesamtumfang 48 Seiten

## **Beginn der Gültigkeit**

Die von CENELEC am 2002-09-01 angenommene EN 61967-6 gilt zusammen mit der am 2008-04-01 angenommenen Änderung A1 als DIN-Norm ab 2008-10-01.

Daneben darf DIN EN 61967-6:2003-05 noch bis 2011-04-01 angewendet werden.

## **Nationales Vorwort**

*Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN IEC 61967-6/A1:2005-06.*

Für diese Norm ist das nationale Arbeitsgremium K 631 „Halbleiterbauelemente“ der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE ([www.dke.de](http://www.dke.de)) zuständig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom SC 47A „Integrated circuits“ erarbeitet.

Die Änderung A1 zu EN 61967-6:2002 ist in dieser Norm eingearbeitet und mit einem Randstrich gekennzeichnet.

Wie aus dem Titel und Inhalt der vorliegenden Norm ersichtlich, wird hierin ein Messverfahren festgelegt. Das zuständige Arbeitsgremium K 631 weist daher auf folgenden Umstand besonders hin:

Die aus dem Originaltext IEC 61967-6:2002 direkt übersetzten Benennungen „Messung/messen“ (en: measurement/to measure bzw. fr: mesure/mesurer) und „Prüfung/prüfen“ (en: test/to test bzw. fr: essai/essayer) sind in der vorliegenden Norm Synonyme zum Begriff „Messung/messen“.

Für den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die Verweisung auf die jeweils neueste gültige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Für den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ergibt sich, soweit ein Zusammenhang besteht, grundsätzlich über die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation. Beispiel: IEC 60068 ist als EN 60068 als Europäische Norm durch CENELEC übernommen und als DIN EN 60068 ins Deutsche Normenwerk aufgenommen.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Änderung und der Grundpublikation bis zu dem Datum (maintenance result date) unverändert bleiben soll, das auf der IEC-Website unter „<http://webstore.iec.ch>“ zu dieser Publikation angegeben ist. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation

- bestätigt,
- zurückgezogen,
- durch eine Folgeausgabe ersetzt oder
- geändert.

Die Reihe IEC 61967 besteht aus folgenden Teilen unter dem allgemeinen Titel „Integrated circuits – Measurement of electromagnetic emissions, 150 kHz to 1 GHz“:

- Part 1: General conditions and definitions
- Part 2: Measurement of radiated emissions – TEM cell and wideband TEM cell method
- Part 3: Measurement of radiated emissions – Surface scan method<sup>1)</sup>
- Part 4: Measurement of conducted emissions – 1 Ohm/150 Ohm direct coupling method
- Part 5: Measurement of conducted emissions – Workbench Faraday Cage method
- Part 6: Measurement of conducted emissions – Magnetic probe method

### **Änderungen**

Gegenüber DIN EN 61967-6:2003-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Der neue informative Anhang E wurde ergänzt. Hierin wird eine verbesserte Magnetsonde beschrieben, die ein hohes räumliches Auflösungsvermögen hat, damit die magnetischen Felder in der Nähe von IC-Gehäusen und dicht gepackten Leiterplatten genau gemessen werden können.
- b) Hinweise auf die neuen Festlegungen zur vorgesehenen Gültigkeit der Norm und die in der IEC-Reihe veröffentlichten Publikationen wurden aktualisiert.
- c) Editorielle Korrekturen des Normtextes vorgenommen.

### **Frühere Ausgaben**

DIN EN 61967-6: 2003-05

---

<sup>1)</sup> Veröffentlicht als IEC/TS.